

# Surfscan® SP A2/A3

無圖案晶圓檢測系統可以針對半導體晶片上的多種影響良率及可靠度的關鍵缺陷及表面品質問題進行檢測

## 優勢：

Surfscan SP A2和 SP A3通過對關鍵缺陷進行高敏度和高產量的檢測，協助晶片、晶圓和設備製造商實現製程和製程設備的認證和監控，並協助汽車晶片製造商：

- 通過分析辨認可能影響晶片可靠性的隨機缺陷的起源，在研發和量產中達成零缺陷的要求
- 實施持續改進計劃，解決製程設備缺陷的來源，確保所有製程設備達到汽車可靠性目標的最低標準
- 確認汽車工作流程中的最佳製程設備

## 技術：

- DUV雷射光源和DUV優化光學系統
- 可同時執行標準暗場與可選配明場檢測模式
- 自動缺陷和缺陷特徵分類
- 先進的圖像電腦及演算法
- SURFmonitor™ 表面品質測量與表徵分析
- SurfServer® 機群程式管理

## 應用：

- 晶圓的入廠和出廠品質控制
- 在大批量製造期間對材料、化學原料、製程和製程設備進行認證和監控
- 研發中的製程特徵、調校和認證



## 市場：

包括眾多半導體製造領域

- 用於汽車、物聯網、5G、消費電子、工業（軍事、航空、醫療）的較大設計節點元件的晶片製造
- 晶圓製造
- 半導體設備和材料/化學原料製造

## 平台：

- 可訂製的配置

## 晶圓尺寸：

- Surfscan SP A3: 300mm
- Surfscan SP A2: 200mm, 150mm

## 更多資料：

[www.kla.com/products/chip-manufacturing/defect-inspection-review#product-sp-a2](http://www.kla.com/products/chip-manufacturing/defect-inspection-review#product-sp-a2)